

## SN74AC08-EP クワッド 2 入力正論理 AND ゲート

### 1 特長

- 管理されたベースライン
  - 1 つのアセンブリ / テスト拠点と 1 つの製造拠点
- 拡張温度範囲:-55°C~125°C
- 強化された DMS (Diminishing Manufacturing Sources) のサポート
- 早期製品変更通知 (PCN)
- 認定系譜 †
- 2V~6V の V<sub>CC</sub> で動作
- 6V までの入力許容電圧
- 最大 t<sub>pd</sub> 7.5ns (5V 時)

<sup>1</sup>

### 2 概要

SN74AC08 はクワッド 2 入力正論理 AND ゲートです。デバイスは、ブル関数  $Y = A \cdot B$  つまり、 $Y = \bar{A} + \bar{B}$  を正論理で実行します。

#### パッケージ情報

部品番号	パッケージ <sup>1</sup>	パッケージ・サイズ <sup>2</sup>
SN74AC08-EP	D (SOIC, 14)	8.65mm × 3.91mm

- 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- パッケージ・サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。

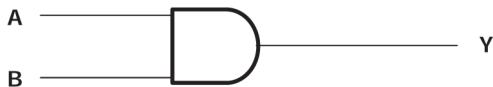


図 2-1. 各ゲートの論理図 (正論理)

<sup>1</sup> † JEDEC および業界標準に従った部品認定により、拡張温度範囲にわたって高信頼性の動作を保証します。これには、HAST (Highly Accelerated Stress Test) またはバイアス付き 85/85、温度サイクル、高圧またはバイアスなし HAST、電気移動法、結合部金属間化合物の寿命、複合金型の寿命が含まれますが、これらに限定されません。これらの認定テストは、この部品を規定の性能および環境の制限外で使用することを正当化すると見なされるものではありません。



英語版の TI 製品についての情報を翻訳したこの資料は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しているものです。該当する正式な英語版の最新情報は、[www.ti.com](http://www.ti.com) で閲覧でき、その内容が常に優先されます。TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、必ず最新版の英語版をご参考くださいますようお願いいたします。

## Table of Contents

1 特長.....	1	6 Parameter Measurement Information.....	6
2 概要.....	1	7 Detailed Description.....	7
3 Revision History.....	2	7.1 Functional Block Diagram.....	7
4 Pin Configuration and Functions.....	3	7.2 Device Functional Modes.....	7
5 Specifications.....	4	8 Device and Documentation Support.....	8
5.1 Absolute Maximum Ratings.....	4	8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	8
5.2 Recommended Operating Conditions.....	4	8.2 サポート・リソース.....	8
5.3 Thermal Information.....	4	8.3 Trademarks.....	8
5.4 Electrical Characteristics.....	5	8.4 静電気放電に関する注意事項.....	8
5.5 Switching Characteristics, $V_{CC} = 3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$ .....	5	8.5 用語集.....	8
5.6 Switching Characteristics, $V_{CC} = 5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$ .....	5	9 Mechanical, Packaging, and Orderable Information....	9
5.7 Operating Characteristics.....	5		

## 3 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

### Changes from Revision \* (September 2003) to Revision A (June 2023)

- |   | Page |
|---|------|
| • 「パッケージ情報」表、「ピン機能」表、「熱に関する情報」表、「デバイスの機能モード」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加 ..... | 1    |

## 4 Pin Configuration and Functions

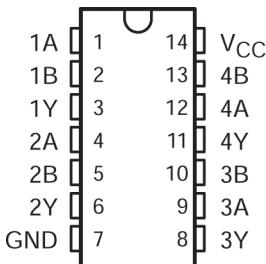


图 4-1. D Package (Top View)

表 4-1. Pin Functions

PIN		TYPE	DESCRIPTION
NAME	NO.		
1A	1	Input	Channel 1, Input A
1B	2	Input	Channel 1, Input B
1Y	3	Output	Channel 1, Output Y
2A	4	Input	Channel 2, Input A
2B	5	Input	Channel 2, Input B
2Y	6	Output	Channel 2, Output Y
GND	7	—	Ground
3Y	8	Output	Channel 3, Output Y
3A	9	Input	Channel 3, Input A
3B	10	Input	Channel 3, Input B
4Y	11	Output	Channel 4, Output Y
4A	12	Input	Channel 4, Input A
4B	13	Input	Channel 4, Input B
V <sub>CC</sub>	14	—	Positive Supply

## 5 Specifications

### 5.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)<sup>(1)</sup>

			MIN	MAX	UNIT
V <sub>CC</sub>	Supply voltage range		-0.5	7	V
V <sub>I</sub> <sup>(1)</sup>	Input voltage range		-0.5	V <sub>CC</sub> + 0.5	V
V <sub>O</sub> <sup>(1)</sup>	Output voltage range		-0.5	V <sub>CC</sub> + 0.5	V
I <sub>IK</sub>	Input clamp current	(V <sub>I</sub> < 0 or V <sub>I</sub> > V <sub>CC</sub> )		±20	mA
I <sub>OK</sub>	Output clamp current	(V <sub>O</sub> < 0 or V <sub>O</sub> > V <sub>CC</sub> )		±20	mA
I <sub>O</sub>	Continuous output current	(V <sub>O</sub> = 0 to V <sub>CC</sub> )		±50	mA
	Continuous current through V <sub>CC</sub> or GND			±200	mA
T <sub>stg</sub>	Storage temperature range		-65	150	°C

- (1) Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
- (2) The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed.

### 5.2 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)<sup>(1)</sup>

			MIN	MAX	UNIT
V <sub>CC</sub>	Supply voltage		2	6	V
V <sub>IH</sub>	High-level input voltage	V <sub>CC</sub> = 3 V	2.1		V
		V <sub>CC</sub> = 4.5 V	3.15		
		V <sub>CC</sub> = 5.5 V	3.85		
V <sub>IL</sub>	Low-level input voltage	V <sub>CC</sub> = 3 V	0.9		V
		V <sub>CC</sub> = 4.5 V	1.35		
		V <sub>CC</sub> = 5.5 V	1.65		
V <sub>I</sub>	Input voltage		0	V <sub>CC</sub>	V
V <sub>O</sub>	Output voltage		0	V <sub>CC</sub>	V
I <sub>OH</sub>	High-level output current	V <sub>CC</sub> = 3 V	-12		mA
		V <sub>CC</sub> = 4.5 V	-24		
		V <sub>CC</sub> = 5.5 V	-24		
I <sub>OL</sub>	Low-level output current	V <sub>CC</sub> = 3 V	12		mA
		V <sub>CC</sub> = 4.5 V	24		
		V <sub>CC</sub> = 5.5 V	24		
Δt/ΔV	Input transition rise or fall rate			8	ns/V
T <sub>A</sub>	Operating free-air temperature		-55	125	°C

- (1) All unused inputs of the device must be held at V<sub>CC</sub> or GND for proper device operation. Refer to the TI application report, *Implications of Slow or Floating CMOS Inputs*, literature number SCBA004.

### 5.3 Thermal Information

THERMAL METRIC <sup>(1)</sup>	SN74AC08-EP	UNIT
	D (SOIC)	
	14 PINS	
R <sub>θJA</sub>	Junction-to-ambient thermal resistance	86 °C/W

- (1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the [IC Package Thermal Metrics](#)

## 5.4 Electrical Characteristics

over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	V <sub>CC</sub>	T <sub>A</sub> = 25°C			MIN	MAX	UNIT
			MIN	TYP	MAX			
V <sub>OH</sub>	I <sub>OH</sub> = -50 µA	3 V	2.9			2.9		V
		4.5 V	4.4			4.4		
		5.5 V	5.4			5.4		
	I <sub>OH</sub> = -12 mA	3 V	2.56			2.4		
		4.5 V	3.86			3.7		
		5.5 V	4.86			4.7		
V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> = 50 µA	3 V	0.002	0.1		0.1		V
		4.5 V	0.001	0.1		0.1		
		5.5 V	0.001	0.1		0.1		
	I <sub>OL</sub> = 12 mA	3 V		0.36		0.5		
		4.5 V		0.36		0.5		
		5.5 V		0.36		0.5		
I <sub>I</sub>	A or B ports	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> or GND	5.5 V		±0.1		±1	µA
I <sub>CC</sub>		V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> or GND, I <sub>O</sub> = 0	5.5 V		2		40	µA
C <sub>i</sub>		V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> or GND	5 V		4.5			pF

## 5.5 Switching Characteristics, V<sub>CC</sub> = 3.3 V ± 0.3 V

over recommended operating free-air temperature range, V<sub>CC</sub> = 3.3 V ± 0.3 V (unless otherwise noted) (see [Load Circuit and Voltage Waveforms](#))

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	T <sub>A</sub> = 25°C			MIN	MAX	UNIT
			MIN	TYP	MAX			
t <sub>PLH</sub>	A or B	Y	1.5	7.5	9.5	1	12.5	ns
			1.5	7	8.5	1	11.5	

## 5.6 Switching Characteristics, V<sub>CC</sub> = 5 V ± 0.5 V

over recommended operating free-air temperature range, V<sub>CC</sub> = 5 V ± 0.5 V (unless otherwise noted) (see [Load Circuit and Voltage Waveforms](#))

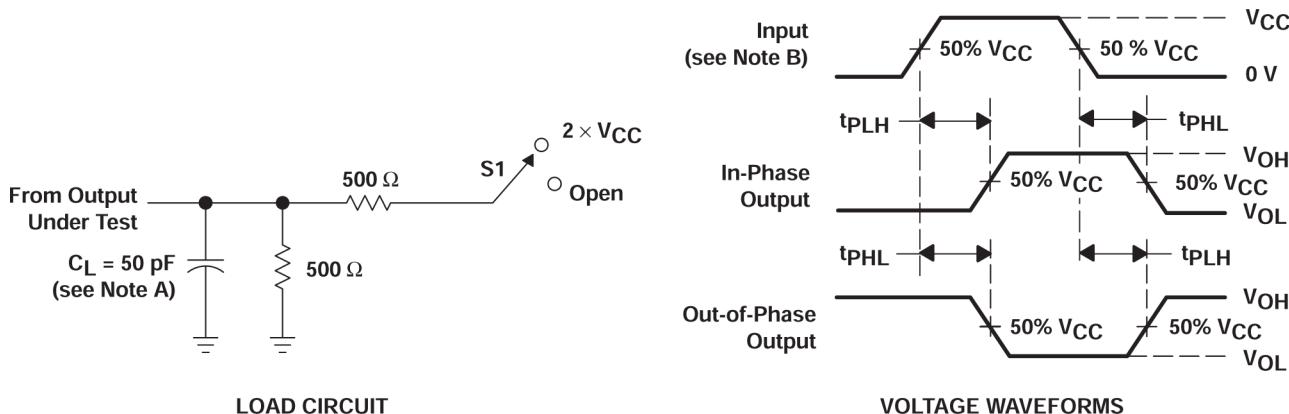
PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	T <sub>A</sub> = 25°C			MIN	MAX	UNIT
			MIN	TYP	MAX			
t <sub>PLH</sub>	A or B	Y	1.5	5.5	7.5	1	9	ns
			1.5	5.5	7	1	8.5	

## 5.7 Operating Characteristics

V<sub>CC</sub> = 5 V, T<sub>A</sub> = 25°C

PARAMETER	TEST CONDITIONS	TYP	UNIT
C <sub>pd</sub> Power dissipation capacitance	C <sub>L</sub> = 50 pF, f = 1 MHz	20	pF

## 6 Parameter Measurement Information



- A.  $C_L$  includes probe and jig capacitance.
- B. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR  $\leq$  1 MHz,  $Z_O = 50 \Omega$ ,  $t_r \leq 2.5$  ns,  $t_f \leq 2.5$  ns.
- C. The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement.

**FIGURE 6-1. Load Circuit and Voltage Waveforms**

TEST	S1
$t_{PLH}/t_{PHL}$	Open

## 7 Detailed Description

### 7.1 Functional Block Diagram

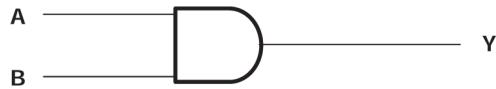


图 7-1. Logic Diagram, Each Gate (Positive Logic)

### 7.2 Device Functional Modes

表 7-1. Function Table (Each Gate)

INPUTS		OUTPUT Y
A	B	
H	H	H
L	X	L
X	L	L

## 8 Device and Documentation Support

TI offers an extensive line of development tools. Tools and software to evaluate the performance of the device, generate code, and develop solutions are listed below.

### 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[更新の通知を受け取る] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 8.2 サポート・リソース

TI E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。[TI の使用条件](#)を参照してください。

### 8.3 Trademarks

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 8.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 8.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 9 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
SN74AC08MDREP	OBSOLETE	SOIC	D	14	TBD	Call TI	Call TI	-55 to 125	SAC08MEP		

(1) The marketing status values are defined as follows:

**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBSOLETE:** TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

**RoHS Exempt:** TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

**Green:** TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74AC08-EP :**

- Catalog : [SN74AC08](#)

- Automotive : [SN74AC08-Q1](#)

- Military : [SN54AC08](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects
- Military - QML certified for Military and Defense Applications

## 重要なお知らせと免責事項

TIは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Webツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1)お客様のアプリケーションに適したTI製品の選定、(2)お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3)お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているTI製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TIはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TIや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TIおよびその代理人を完全に補償するものとし、TIは一切の責任を拒否します。

TIの製品は、[TIの販売条件](#)、または[ti.com](#)やかかるTI製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TIがこれらのリソースを提供することは、適用されるTIの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TIはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated